

VIII Научно-практическая конференция НАН Украины

**«Новейшие разработки научного оборудования ведущих приборостроительных компаний.
Развитие центров коллективного пользования в НАН Украины»**

Дата и время проведения	17 октября 2017 года, 10.30 – 16.30
Место проведения:	г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, зал № 8
Организатор:	Национальная академия наук Украины

ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ:*

Организационный комитет:

ак. НАН Украины В.Ю. Сторижко	– председатель конференции, председатель Межведомственного совета по научному приборостроению при Президиуме НАН Украины
к.филос.н. О.Н. Кубальский	– зам. председателя, первый заместитель главного ученого секретаря НАН Украины - начальник Научно-организационного отдела Президиума НАН Украины
к.ф.-м.н. В.Л. Майстренко	– заместитель начальника Научно-организационного отдела Президиума НАН Украины
к.ф.-м.н. В.А. Котенко	– заместитель начальника Научно-организационного отдела Президиума НАН Украины
к.ф.-м.н. Ю.І. Жирко	– секретарь Комиссии по вопросам модернизации парка научных приборов и оборудования НАН Украины
к.т.н. А.Я. Колтун	– директор Экспозиционного центра «Наука» НАН Украины
к.т.н. В.І. Костецкий	– секретарь конференции

11.00 – 11.05	Вступительная речь на открытии научно-практической конференции Сторижко Владимир Ефимович - председатель конференции, акад. НАН Украины
11.05 – 11.30	Разработка портативного широкографического прибора для бесконтактной диагностики конструкций из металлических и композиционных материалов Савицкий В.В., к.т.н., с.н.с. Института электросварки им. Е.А. Патона НАН Украины
11.30 – 11.50	Разработка системы измерения трибологических характеристик тонких пленок Марченко А.А., чл.-корр. НАН Украины, зав. отдела Института физики НАН Украины
11.50 – 12.10	Разработка и создание компактного метеорологического радиолокатора Ka-диапазона для научных исследований Варвив Д.М., чл.-корр. НАН Украины, зам. директора Радиоастрономического института НАН Украины
12.10 – 12.40	Перерыв
12.40 – 13.00	Современное научно-аналитическое оборудование для науки и промышленности от японской компании Tokyo Voeki Technology Ltd Тиньков В.О., представитель компании Tokyo Voeki
13.00 – 13.20	Современные решения компании Leica Microsystems для микроскопии и пробоподготовки для электронной микроскопии Гребельник М.М., представитель компании АЛТ Украина Лтд
13.20 – 13.40	Оборудование для элементного, молекулярного, термоанализа и оборудование для анализа поверхности предлагает компания INTERTECH Corporation Артемьева И.М., представитель компании INTERTECH Corporation
13.40 – 14.00	Практический опыт использования испытательного оборудования Instron® в научных организациях и промышленном комплексе Украины. Важность и необходимость услуг прослеживается калибровки по международным стандартам Новиков Д.А., представитель компании LECO

14.00 – 14.20	<i>Новейшие разработки корпорации SHIMADZU в области аналитического приборостроения</i> <i>Сухомлинов А.Б., представитель компании ШимЮкрейн</i>
14.20 – 14.40	<i>Атомно-силовая микроскопия Bruker: от атомного разрешения до динамики процессов на поверхности</i> <i>Фокин Д.А., представитель компании OPTEC LLC</i>
14.40 – 15.00	<i>Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS): характеристики, принцип работы, применение</i> <i>Юрий Калиниченко, представитель компании MixLab</i>
15.00 – 16.30	<i>Круглый стол - О развитии центров коллективного пользования в НАН Украины</i> <i>с участием ученых Украины, представителей фирм-производителей, Организационного комитета конференции</i>

Участие в научно-практических мероприятиях выставки бесплатное!

**В программе возможны изменения и дополнения*